

## **JOURNEES PEDAGOGIQUES 2025 DU GN-MEBA**

### **La cartographie analytique au MEB et à la microsonde**

**4 décembre 2025**

**9h30 – 10h15 Introduction : Image, data cube, résolution spatiale, paramètres d'acquisition, statistique de comptage – Christian MATHIEU - Université d'Artois, UCCS Artois**

*Résumé*

**10h15 – 11h00 L'imagerie analytique en EDS et en WDS : acquisition, traitements, exemples – Guillaume WILLE<sup>1,2</sup>**

<sup>1</sup>BRGM – 3 avenue Claude Guillemin – BP36009 – 45060 Orléans cedex 2

<sup>2</sup>MACLE-CVL – UAR 2590 - 1A rue de la Férollerie - 45071 Orléans Cedex 2

*L'imagerie en spectrométrie de rayons X, généralement appelée cartographie, est le mode d'imagerie analytique le plus courant au microscope électronique, qu'il s'agisse du MEB, de la microsonde électronique ou du MET/STEM. Elle est obtenue par l'utilisation des détecteurs EDS et/ou WDS. La cartographie représente la distribution d'un ou plusieurs éléments chimiques sur une zone donnée de l'échantillon.*

*La donnée obtenue peut être en intensité brute, ou traitée de différentes façons de manière à préciser ou spécialiser l'information (intensité nette après soustraction du fond continu, données semi-quantitatives, combinaison d'éléments, phases chimiques...). Le choix de l'EDS, du WDS ou de la combinaison des deux techniques dépend de l'objectif recherché. En effet, plusieurs éléments influent sur le résultat, conditions d'acquisition (durée, conditions de faisceau, dimensions du champ), éléments chimiques (nombre d'éléments, raies de basse énergie, interférences), précision et/ou de sensibilité... Selon le type d'acquisition réalisée et les conditions opératoires, la cartographie en spectrométrie de rayons X par EDS ou WDS peut fournir des résultats plus ou moins élaborés, depuis la simple répartition des éléments majeurs jusqu'à des données plus complexes telles que la répartition des phases de même composition chimique (cartographies minéralogiques, nature et distribution de précipités dans un alliage...). Au cours de cet exposé, nous verrons également que le choix de l'une, de l'autre ou de la combinaison des deux techniques sera guidé par le type d'information recherchée, tels que la teneur (éléments mineurs et traces), le risque d'interférences entre raies d'éléments analysés, le nombre d'éléments cartographiés, etc.*

**11h00 – 11h30 SXES – Jean-Louis LONGUET - CEA Le Ripault**

*Résumé*

**11h30 – 12h00 Spécificité de la préparation des échantillons biologiques pour les analyses EDS – Isabelle SVAHN - Bordeaux Imaging Center / Imagerie Electronique, UAR 3420 CNRS US4 INSERM**

*Résumé*

**12h00 – 13h45 Déjeuner libre**

**13h45 – 14h30 Assemblée générale** du GN-MEBA

**14h30 – 15h00 Minéralogie automatisée au MEB/ $\mu$ XRF : apport du logiciel AMICS pour la caractérisation rapide des roches** – Andréï LECOMTE - GeoRessources - Plateforme SCMEM, Faculté des Sciences et Techniques, Vandoeuvre les Nancy

*La minéralogie automatisée, terme inventé au début des années 2000, est une technique d'identification de phases au MEB développée dans les années 70 au CSIRO, agence du gouvernement australien qui supervise la recherche scientifique et le lien avec les applications industrielles. Si l'objectif initial était d'automatiser l'acquisition d'un maximum de points EDS pour mieux quantifier les phases de l'échantillon, il apparut que l'utilisation d'une image BSE haute résolution permettait d'obtenir davantage d'informations texturales et de limiter le nombre d'analyses nécessaires. Cette nouvelle approche, couplée à l'apparition sur le marché des détecteurs SDD de plus en plus performants, a permis la commercialisation de différents systèmes notamment auprès des compagnies minières qui en étaient les principaux utilisateurs. Nous ferons ici un focus sur la solution AMICS, adaptée sur MEB ou  $\mu$ XRF, pour comprendre son fonctionnement et identifier les avantages/inconvénients/points d'attention de chacune des techniques sur la base de différents exemples.*

**15h00 – 15h30 Microsonde de Castaing** – Nicolas RIVIDI - CAMPARIS

*Résumé*

**15h30 – 16h00 Pause**

**16h00 – 16h30 Analyses chimiques quantitatives EDS au MEB par la méthode des f ratios et par la méthode de corrélations** – Raynald GAUVIN - Department of Materials Engineering, McGill University

*Résumé*

**16h30 – 17h00 Cathodoluminescence hyperspectrale couplée à la microsonde dans les roches déformées** – [Laura Airaghi](#)<sup>1</sup>, [Ida di Carlo](#)<sup>1,2</sup>, Gabriel Serrano Lopez<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Institut des Sciences de la Terre d'Orléans (ISTO), UMR 7327, Univ. Orléans, CNRS, BRGM, OSUC, F-45071 Orléans, France

<sup>2</sup> Plateforme MACLE - CVL UAR 2590 - 1A Rue de la Férollerie - 45071 Orléans Cedex 2

*La LUMINESCENCE est un phénomène courant dans les substances inorganiques et organiques lié aux transitions d'émission dans les anions, les molécules ou les cristaux résultant d'un transfert d'électrons d'états électroniques excités vers un état fondamental ou un autre état à plus faible énergie (Marfunin, 1979). Une très ample variété de processus luminescents a lieu dans la nature. La thermoluminescence, la photoluminescence et la cathodoluminescence sont les phénomènes les plus connus utilisés pour étudier les minéraux, les roches et donc les processus qui ont permis leur formation.*

*L'application géologique de la cathodoluminescence hyperspectrale ici présentée concerne la déformation des roches de la croûte terrestre profonde. A ces conditions, les roches accommodent la déformation due aux mouvements des plaques tectoniques de manière ductile, par une variété de possibles mécanismes. Or, il n'est pas toujours évident de déterminer les mécanismes de déformation dominant dans les minéraux composant les roches, bien que chacun de ces mécanismes ait un impact différent sur la résistance de la roche elle-même et donc sur sa capacité à se déformer. Les cartographies en CL hyperspectrale (ici réalisées sur le quartz, l'un des minéraux le plus abondants dans la croûte terrestre) permettent de révéler des variations de composition (en éléments traces) et de défauts cristallins associés à l'échelle du grain et de l'agrégat, là où les autres techniques analytiques ne sont pas assez résolues. Ceci permet de discriminer les mécanismes de recristallisation associés à la déformation des minéraux et de discuter du comportement mécanique des roches crustales profondes.*

**17h00 – 17h30 Cartographies X des échantillons biologiques et polymères : précautions sur la préparation d'échantillon et les conditions d'acquisition – Xavier JAURAND - Centre Technologique des Microstructures, Université Claude Bernard Lyon1**

*L'analyse EDS et la cartographie des échantillons biologiques et des polymères nécessitent des techniques spécifiques de préparation ainsi que l'adoption de conditions d'acquisition optimisées pour préserver l'intégrité structurale et la composition chimique de l'état natif. Différentes méthodes sont comparées, avec leurs avantages et leurs inconvénients, en démontrant que les techniques traditionnelles ne sont généralement pas du tout adaptées à l'acquisition de cartographies. Toutefois, même un échantillon bien préparé posera des défis pour appliquer des conditions d'analyses satisfaisantes car dans la plupart des cas, ces types d'échantillons ne contiennent que des éléments légers, et ceux-ci ne sont présents qu'en faibles voire très faibles concentrations. En outre, ces échantillons ne tolèrent généralement ni les fortes énergies, ni les forts courants, et peuvent très facilement être dégradés par le faisceau.*

**5 décembre 2025**

**9h - 9h30** HEA : cartographie EBSD avec filtre EDS pour identification de phase – Alexandre TANGUY - Plateforme MiMeCA, Laboratoire de mécanique des solides, CNRS UMR7649, Ecole Polytechnique, Palaiseau

*Résumé*

**9h30 – 10h00** **Measuring Hydrostatic Dilatation by High-Resolution Electron Back-Scatter Diffraction** – Qiwei Shi<sup>1\*</sup>, Dominique Loisonard<sup>2</sup>, Maxime Mollens<sup>2</sup>, Stéphane Roux<sup>3</sup>

<sup>1</sup>SJTU-Paris Elite Institute of Technology, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, 200240, China

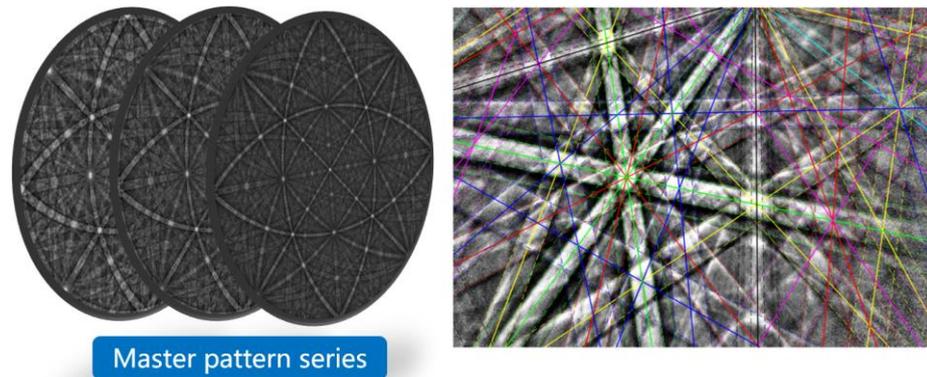
<sup>2</sup>EdF R&D, Site des Renardières, avenue des Renardières, Ecuelles, F-77818 Moret-sur-Loing, France

<sup>3</sup>Université Paris-Saclay, CentraleSupélec, ENS Paris-Saclay, CNRS, LMPS- Laboratoire de Mécanique Paris-Saclay, F-91190, Gif-sur-Yvette, France

\* Corresponding author: sqw@sjtu.edu.cn

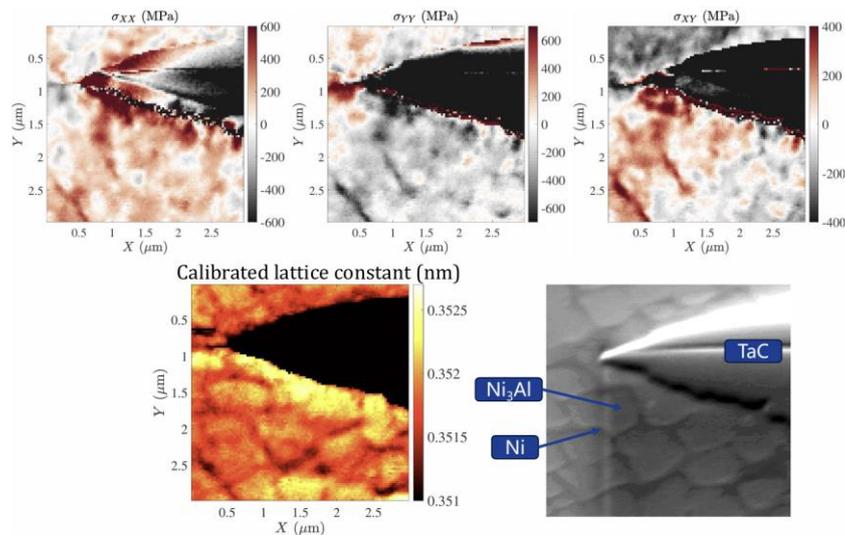
*The High-Resolution Electron Backscatter Diffraction (HR-EBSD) technique has drawn attention in recent years, mainly thanks to its ability to assess the elastic strain/stress state with a sub-micron spatial resolution. By correlating a target pattern with a reference one — either experimental <sup>[1]</sup> or simulated <sup>[2]</sup> — only 8 out of the 9 components of the displacement gradient tensor relative to the reference can be obtained. The 9th one corresponds to the hydrostatic dilatation and is inaccessible by the correlation itself. It is often complemented by a stress-free boundary condition on the analyzed surface <sup>[3]</sup>.*

*The Integrated Digital Image Correlation (IDIC) frame has been proposed to correlate experimental diffraction patterns to simulated master patterns <sup>[4]</sup>, to calibrate the energy distribution of back-scattered electrons (BSE) <sup>[5]</sup> and absolute stress fields <sup>[6]</sup>. Here, an IDIC method is proposed to measure the (in-plane) absolute stress from the elastic strain, including hydrostatic dilatation. It registers an experimental pattern to several master patterns corresponding to a unique lattice constant and varying energy levels of back-scattered electrons, as shown in Figure 1. In EBSD practice, the average BSE energy is constant for a scan, hence the variation of the calibrated BSE energy is due to the dilatation of sample lattice. Due to the shallow inspection depth of EBSD, the free-surface property (vanishing stress vector at the observation surface) is also adopted. On the one hand, it helps to reduce the degrees of freedom and enhance precision. On the other hand, most importantly, it distinguishes the hydrostatic dilatation due to elastic strain from lattice constant variation.*



**Figure 1.** Sketch of the proposed method. (Left) A series of master pattern of different acceleration voltages (thus different Kikuchi band width). (Right) An experimental diffraction pattern, whose Kikuchi band width is employed in image correlation with the master pattern.

Through tests on high quality experimental patterns on a standard Si/SiGe sample and an industrial Ni single crystal with TaC inclusions, the proposed method proves robust and precise. The in-plane stress components and the lattice constant can be simultaneously obtained, as shown in the Ni results (Figure 2). The Ni matrix at the tip of the TaC exhibits high tensile stresses. The lattice constant contrast of the cell interior (Ni<sub>3</sub>Al) and the cell boundary (Ni) are highly visible and coincide with the secondary electron image. Both the systematic and random errors of the dilation results are below 10<sup>-3</sup>.



**Figure 2.** Characterization of a Ni-Al/TaC sample. (top) In-plane stress components  $\sigma_{XX}, \sigma_{YY}, \sigma_{XY}$ ; (bottom) Distribution of the calibrated lattice constant of Ni-Al, and a secondary electron image of the sample, with the 3 phases indicated.

**References:**

- [1] A.J. Wilkinson et al. High resolution mapping of strains and rotations using electron backscatter diffraction. *Materials Science and Technology*, 22(11):1271–1278, 2006.
- [2] B.E. Jackson et al. Performance of dynamically simulated reference patterns for cross-correlation electron backscatter diffraction. *Microscopy and Microanalysis*, 22(4):789–802, 2016.
- [3] C. Maurice et al. On solving the orientation gradient dependency of high angular resolution EBSD. *Ultramicroscopy*, 113:171–181, 2012.
- [4] S. Singh et al. EMsoft: Open source software for electron diffraction/image simulations. *Microscopy and MicroAnalysis*, 23:S1:212–213, 2017.
- [5] Q. Shi et al. Improved EBSD indexation accuracy by considering energy distribution of diffraction patterns. *Materials Characterization*, 188:111909, 2022.
- [6] Q. Shi et al. Towards measuring absolute residual stress by HR-EBSD with simulated reference patterns. *Materials Characterization*, 218:114508, 2024.

**10h00 – 10h30 Introduction à l'analyse en mode diffraction en transmission (TKD) dans le MEB – Matteo RUSSO, Sophie CAZOTTES - INSA Lyon, LaMCos - MATEIS**

*L'analyse par diffraction des électrons rétrodiffusés (EBSD) est une technique de caractérisation de la microstructure des matériaux, réalisée au microscope électronique à balayage (MEB), fournissant des informations sur l'orientation cristalline des grains, la répartition des phases et la distribution des défauts cristallins, sur des régions d'intérêt relativement étendues. Cependant, la résolution spatiale de l'EBSD conventionnel reste limitée par le volume d'interaction entre les électrons incidents et le matériau, atteignant une résolution typique comprise entre 20 et 150 nm [1]. Ainsi, son efficacité pour la caractérisation de microstructures nanométriques ou fortement déformées est réduite. Des techniques d'analyse cristallographique à plus haute résolution spatiale se rendent alors nécessaires. Dans ce contexte, la diffraction en transmission des clichés Kikuchi (Transmission Kikuchi Diffraction, TKD), technique introduite par R. Keller et R. Geiss [2], constitue une alternative accessible et performante à la fois à l'EBSD conventionnelle et à la microscopie électronique en transmission (MET).*

*Contrairement à l'EBSD, le TKD repose sur l'analyse d'échantillons amincis (<100 nm), type lame MET ou lame FIB, réduisant significativement la zone d'interaction électronique et permettant d'atteindre des résolutions spatiales de l'ordre de 10 nm, voire inférieures [3]. Les deux configurations principalement utilisées dans le TKD seront présentées : le montage « off-axis », qui utilise la caméra EBSD standard sans modification matérielle, et le montage « on-axis », qui nécessite un détecteur dédié centré sous l'échantillon, permettant de récupérer une quantité plus importante d'électrons diffractés et donc de diminuer les temps de pose par pixels.*

Références :

[1] G. C. Sneddon, P. W. Trimby, J. M. Cairney, *Transmission Kikuchi diffraction in a scanning electron microscope: A review, Materials Science and Engineering: R: Reports* 110 (2016) 1–12. doi:10.1016/j.mser.2016.10.001.

[2] R. Keller, R. Geiss, *Transmission EBSD from 10 nm domains in a scanning electron microscope, Journal of Microscopy* 245 (2012) 245–251. doi:10.1111/j.1365-2818.2011.03566.x.

[3] R. van Bremen, D. Ribas Gomes, L. T. H. de Jeer, V. Ocelík, J. T. M. De Hosson, *On the optimum resolution of transmission-electron backscattered diffraction (t-EBSD), Ultramicroscopy* 160 (2016) 256–264. doi:10.1016/j.ultramic.2015.10.025.

**10h30 – 14h00 Exposition Constructeurs** au Centre International de Congrès de Sorbonne Université (salle 102, Tour 44, 1er étage)

Pause-café et Buffet de midi offerts par l'ensemble des constructeurs et le GN-MEBA

**14h00 – 14h30 Cartographie de nano-indentation** – Xavier FEAUGAS - Laboratoire des Sciences de l'Ingénieur pour l'Environnement

*Résumé*

**14h30 – 15h00 La Nanospace ou le défi du développement d'un TOF-SIMS sur une plateforme UHV FIB/SEM** – Fabrice GOURBILLEAU – CIMAP Caen

*Le CIMAP, Centre de Recherche sur les Ions, les Matériaux et la Photonique (UMR 6252 CNRS, CEA, Ensicaen, Université de Caen) a acquis un équipement couplant l'imagerie de microscopie électronique à balayage (MEB) avec une colonne ionique focalisée plasma (FIB) pour la gravure et un spectromètre de masse des ions secondaires par temps de vol (TOF-SIMS). Cet appareil, la NanoSpace, a été développé par la société Orsay Physics basée à Fuveau sur une plateforme UHV FIB/SEM de la société TESCAN. Cet appareil permet dans un environnement UHV d'obtenir une résolution inférieure à 4 nm en MEB et une résolution de 12 nm en FIB Xénon avec une vitesse d'abrasion 50 fois plus rapide qu'une source Gallium. En ce qui concerne le TOF-*

## **GN-MEBA – JOURNEES PEDAGOGIQUES – Jussieu, Paris – 4-5 décembre 2025**

*SIMS, la résolution en masse est de 4500 sur le  $^{28}\text{Si}$ , une résolution en imagerie inférieure à 60 nm sur un domaine en masse de 0 à 500u.*

*Au cours de cet exposé, je vous présenterai cet équipement ainsi que les tests réalisés et les résultats obtenus dans divers domaines allant des matériaux inorganiques jusqu'aux échantillons biologiques. La NanoSpace offre la possibilité de réaliser des images corrélatives SEM/SIMS voire SEM/EDX/SIMS puisqu'elle peut aussi accueillir un spectromètre EDX-UHV. Elle possède des avantages mais aussi, comme tout équipement, des inconvénients que j'aborderai via des approches expérimentales.*

**15h00 – 15h30 Reconstruction de surface 3D par stéréoscopie MEB – Denis BOIVIN - Retraité ONERA**

*Résumé*